

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60191-2Y

Première édition
First edition
1966

Vingt-troisième complément à la
Publication 60191-2 (1966)

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

Partie 2:
Dimensions

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a508-454b-95ca-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

Twenty-third supplement to Publication 60191-2 (1966)

**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

Part 2:
Dimensions

*Les feuilles de ce complément sont à insérer dans la
Publication 60191-2*

*The sheets contained in this supplement are to be
inserted in Publication 60191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

T

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60191-2Y:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Replace the existing title page with the new title page.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface au vingt-troisième complément.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to the twenty-third supplement.

Chapitre I:

Chapter I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-136E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l
60191 IEC I-137E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l

60191 IEC I-136E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l
60191 IEC I-137E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l

Retirer les feuilles suivantes:

Remove the following sheets:

60191 IEC I-133E - a/b/c/d/e
60191 IEC I-134E - a/b/c/d
60191 IEC I-135E - a/b/c/d/e

60191 IEC I-133E - a/b/c/d/e
60191 IEC I-134E - a/b/c/d
60191 IEC I-135E - a/b/c/d/e

et les remplacer par les feuilles suivantes:

and substitute them by the following sheets:

60191 IEC I-133E - a/b/c/d/e
60191 IEC I-134E - a/b/c/d/e/f
60191 IEC I-135E - a/b/c/d/e/f/g

60191 IEC I-133E - a/b/c/d/e
60191 IEC I-134E - a/b/c/d/e/f
60191 IEC I-135E - a/b/c/d/e/f/g

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60191-2Y:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60191-2
Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976),
G (1978), H (1978), J (1980), K (1981), L (1982), M (1983),
N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995), S (1995), T(1995),
U(1997), V(1998), W(1999), X(1999), et/and Y(2000)

Vingt-troisième complément à la
Publication 60191-2 (1966)

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

iTeh STANDARD PREVIEW
Partie 2:
Dimensions
(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-67ca93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

Twenty-third supplement to Publication 60191-2 (1966)

**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

**Part 2:
Dimensions**

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60191-2Y:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

**NORMALISATION MÉCANIQUE
DES DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS**

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE	
PRÉFACE	
CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE	Chapitre 00
VALEURS RECOMMANDÉES POUR CER- TAINES DIMENSIONS DE DESSINS DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS	Chapitre 0
DESSINS D'ENCOMBREMENTS	Chapitre I
TYPES DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCT- TEURS GÉNÉRALEMENT MONTÉS DANS LES BOÎTIERS DU CHAPITRE I	
DESSINS D'EMBASES	Chapitre II
DESSINS DE BOÎTIERS	Chapitre III
DESSINS DE CALIBRES.....	Chapitre IV
TABLEAUX MONTRANT LES ASSOCIA- TIONS ENTRE LES BOÎTIERS ET LES EMBASES	Chapitre V
DESSINS OBSOLÈTES	
COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DES NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	
SUPPRESSIONS DANS LES LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DE NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

**MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR
DEVICES**

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD	
PREFACE	
PHILOSOPHY OF MECHANICAL STAN- DARDIZATION	Chapter 00
RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF SEMI- CONDUCTOR DEVICES.....	Chapter 0
DEVICE OUTLINE DRAWINGS	Chapter I
TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES GENERALLY MOUNTED IN THE PACKAGES OF CHAPTER I	
BASE DRAWINGS	Chapter II
CASE OUTLINE DRAWINGS.....	Chapter III
GAUGE DRAWINGS.....	Chapter IV
TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BE- TWEEN CASE OUTLINES AND BASES.....	Chapter V
OBSOLETE DRAWINGS	
ADDITIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	
DELETIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	

STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
IEC 60191-2Y:2000
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Vingt-troisième complément à la CEI 60191-2 (1966)

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 2: Dimensions

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes Internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

PRÉFACE AU VINGT-TROISIÈME COMPLÉMENT

La présente norme a été établie par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs, et par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Elle constitue le vingt-troisième complément à la CEI 60191-2.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/341+342/FDIS	47D/356+357/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Twenty-third supplement to IEC 60191-2 (1966)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES –****Part 2: Dimensions**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-07e181815600/iec-60191-2y-2000>
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

PREFACE TO THE TWENTY-THIRD SUPPLEMENT

This standard has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices, and by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

It forms the twenty-third supplement to IEC 60191-2.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/341+342/FDIS	47D/356+357/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CHAPITRE 00 – CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE

1. Règles fondamentales

Lors de la réunion tenue à Montreux (juin 1981), le Comité d'Etudes n° 47 adopta les règles fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées à Copenhague en octobre 1962:

- A. Toute proposition nouvelle devra être soumise à l'étude préliminaire d'un groupe de travail convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.
- B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs suivants:
 1. Aboutir à une normalisation active en n'acceptant que les boîtiers qui sont soutenus internationalement.
 2. Spécifier de façon précise les dimensions en vue d'assurer l'interchangeabilité et de faciliter les manipulations automatiques.
 3. Reconsidérer continuellement les dessins existants et proposer la suppression de ceux qui ne sont plus soutenus.
- C. Il ne sera procédé à la discussion d'un dessin de boîtier que s'il a le soutien préalable d'au moins trois pays.
- D. Un dessin ne sera introduit dans la Publication 191-2 de la CEI que si au moins trois des pays qui le soutiennent ont fourni leur numéro de code national (ou exprimé un soutien formel s'ils ne possèdent pas de numéro de code).

Notes 1. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Orlando (février 1980), il a été admis d'étendre le domaine d'activité du GT7 de façon qu'il couvre aussi bien la normalisation mécanique des semiconducteurs discrets que celle des circuits intégrés.

Il a été également admis que, compte tenu de l'élargissement de son domaine d'activité, le GT7 serait le groupe de travail qualifié mentionné dans le paragraphe A.

En vue d'éviter que l'introduction du GT7 dans le processus suivi par le Comité d'Etudes n° 47 pour préparer des documents secrétariat sur la normalisation mécanique provoque des délais supplémentaires, le GT7 a été autorisé à obtenir de la part des trois pays concernés, ou plus, la confirmation directe du maintien de leur appui pour ces propositions.

2. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Montreux (juin 1981), il a été admis que les réunions du GT7 s'intégreraient dans les réunions du Comité d'Etudes n° 47.

Cependant, certaines propositions peuvent nécessiter un temps d'études dépassant la durée d'une réunion du Comité d'Etudes n° 47 et en conséquence requérir une ou plusieurs réunions du GT7 entre deux réunions consécutives du Comité d'Etudes n° 47.

Lors de la réunion tenue à Moscou (juin 1977), le Comité d'Etudes n° 47 adopta la règle suivante:

Lorsqu'un dessin de la Publication 191-2 de la CEI vient à ne plus être soutenu que par un seul pays, il sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intitulée «Dessins obsolètes» avec l'indication de la date de transfert sur la feuille particulière correspondante.

Un avertissement au début de la section dévolue aux dessins obsolètes stipulera qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf s'il est soutenu par un autre pays dans l'intervalle.

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste de dessins (suite)					
Número de code CEI	Code du pays d'origine	Número de page et date			
105B07	105B07	I-105B	1988		
105B08	105B08				
105B09	105B09				
106B01	106B01	I-106B	1988		
105B02	SC-68				
107B01	107B01	I-107B	1988		
107B02	SC-69				
Forme C		I-100C	1990		
100C01	KD10				
100C02					
Forme E		I-46E1	1988		
046E01A	NT23/3A				
046E01B	NT233B				
046E02A	NT143A	I-46E2	1988		
046E02B	NT143B				
075E01	SO192E	I-075E	1990		
075E02	SO192F				
075E03	NT162				
075E04	NT163				
075E05	NT137				
075E06	NT136				
076E01S	FT174A	I-076E	1990		
076E01L	FT174				
076E02S	FT175A				
076E02L	FT175				
076E03S	FT176A				
076E03L	FT176				
076E04S	FT177A				
076E04L	FT177				
076E05S	FT178A				
076E05L	FT178				
076E06S	FT179A				
076E07S	FT179				
076E07L	FT180				
099E				I-099E	1995
100E	NT323 SC-70			I-100E	1996
102E02	MS004-CB	I-102E	1990		
102E03	MS004-CC				
102E04	MS004-CD				
102E05	MS004-CE				
102E06	MS004-CF				
102E07	MS004-CG				
112E01	B1A			I-112E	1990
112E02	(Allemagne)				
112E03	B1C				
112E04	SO195A				
112E05	B1D				
112E06	(Allemagne)				
112E07	B1E				
112E08	SO195B				
112E09	B1G				
112E10	NT185				
112E11	SO195D				
112E12	NT188				
112E13	NT189				
112E14	MO-047AG				
112E15	MO-047AH				
114E01	NT89	I-114E	1988		
115E01	SC-527-8AA	I-115E	1988		
115E02	SC-528-10AA				
115E03	SC-529-14AA				
115E04	SC-530-16AA				

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)					
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date			
105B07	105B07	I-105B	1988		
105B08	105B08				
105B09	105B09				
106B01	106B01	I-106B	1988		
105B02	SC-68				
107B01	107B01	I-107B	1988		
107B02	SC-69				
Form C		I-100C	1990		
100C01	KD10				
100C02					
Form E		I-46E1	1988		
046E01A	NT23/3A				
046E01B	NT233B				
046E02A	NT143A	I-46E2	1988		
046E02B	NT143B				
075E01	SO192E	I-075E	1990		
075E02	SO192F				
075E03	NT162				
075E04	NT163				
075E05	NT137				
075E06	NT136				
076E01S	FT174A	I-076E	1990		
076E01L	FT174				
076E02S	FT175A				
076E02L	FT175				
076E03S	FT176A				
076E03L	FT176				
076E04S	FT177A				
076E04L	FT177				
076E05S	FT178A				
076E05L	FT178				
076E06S	FT179A				
076E07S	FT179				
076E07L	FT180				
099E				I-099E	1995
100E	NT323 SC-70			I-100E	1996
102E02	MS004-CB	I-102E	1990		
102E03	MS004-CC				
102E04	MS004-CD				
102E05	MS004-CE				
102E06	MS004-CF				
102E07	MS004-CG				
112E01	B1A			I-112E	1990
112E02	(Germany)				
112E03	B1C				
112E04	SO195A				
112E05	B1D				
112E06	(Germany)				
112E07	B1E				
112E08	SO195B				
112E09	B1G				
112E10	NT185				
112E11	SO195D				
112E12	NT188				
112E13	NT189				
112E14	MO-047AG				
112E15	MO-047AH				
114E01	NT89	I-114E	1988		
115E01	SC-527-8AA	I-115E	1988		
115E02	SC-528-10AA				
115E03	SC-529-14AA				
115E04	SC-530-16AA				

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste de dessins (suite)			
Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(Etats-Unis)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2000
Forme F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)			
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(USA)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2000
Form F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

iTeh STANDARD PREVIEW
 (standarditeh.ai)

<https://standardsiteh.ai/catalog/standards-list/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste de dessins (suite)					
Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date			
Forme G					
050G01	SO5-87D	}	I-50a/b/c/d	1985	
050G02	SO-188D				
050G03	SO-87A				
050G04	SO-87B				
050G05	SO-188A				
050G06	SO-188B				
050G07	SO-188F				
050G08	SO-87C				
050G10	SO-188C				
050G11	SO505-18A				
050G12	SO-87G				
050G13	SO-188E				
050G14	(Suède)				
050G16	A1AA				
050G17	A1AB				
050G18	A1BA				
050G19	A1BB				
050G20	A1CB				
		}	I-50e	1990	

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)					
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date			
Form G					
050G01	SO5-87D	}	I-50a/b/c/d	1985	
050G02	SO-188D				
050G03	SO-87A				
050G04	SO-87B				
050G05	SO-188A				
050G06	SO-188B				
050G07	SO-188F				
050G08	SO-87C				
050G10	SO-188C				
050G11	SO505-18A				
050G12	SO-87G				
050G13	SO-188E				
050G14	(Sweden)				
050G16	A1AA				
050G17	A1AB				
050G18	A1BA				
050G19	A1BB				
050G20	A1CB				
		}	I-50e	1990	

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

IEC 60191-2Y:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60191-2Y:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>

Types de dispositifs à semiconducteurs
généralement montés dans les boîtiers
du chapitre I de la CEI 60191-2

Types of semiconductor devices
generally mounted in the packages
of chapter I of IEC 60191-2

Type de dispositif Type of device	Numéro de code CEI du dessin du boîtier IEC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Signal diodes and small-power Zener diodes	A1, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69, A70, A71, 098H, 100H
Diodes hyperfréquences Microwave diodes	A18
Diodes de redressement de faible et moyenne puissance Rectifier diodes, small and medium power	A2, A3, A4, A6, A7, A19, A37, A44, A74, 077B, 100B
Diodes de redressement de forte puissance High-power rectifier diodes	A8, A9, A10, A15, A16, A17, A21, A22, A35, 083B, 103B
Thyristors de faible et moyenne puissance Thyristors, small and medium power	A11, A13, A14, A38, A43
Thyristors de forte puissance High-power thyristors	A12, A27, A28, A29, A34, A39, A47, 104B, 105B
Transistors de signal Signal transistors	A36, A40, A41, 068A, 046E, 114E
Transistors de puissance Power transistors	A23, A30, A31, A43, A48, A56, A57, A45, A73, 080B, 081B, 082B, 101B, 102B, 102F, 120E, 084F, P100F
Transistors hyperfréquences Microwave transistors	A26, A42, A43, A59, A66, A72, 100C
Dispositifs optoélectroniques Optoelectronic devices	A62, A64, A65, A63A, 100A, 101A, 106B, 107B
Circuits intégrés Integrated circuits	A52, A53, A61, 075E, 076E, 099E, 100E, 102E, 112E, 115E, 116E, 117E, 118E, 119E, 121E, 122E, 123E, 129E, 133E, 134E, 135E, 136E, 137E, 138E, 139E, 140E, 141E, 144E, 147E, 148E, 149E, 050G, 051G, 060G, 100G, 101G

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/1d2467b9-a509-454b-95ea-b7ea93a48a5c/iec-60191-2y-2000>